

mungen (26 Seiten). Die technische Spannungsmessung wird in 22 Seiten, die amorphen Stoffe mit der 'Kleinwinkelstreuung' in 10 Seiten behandelt. Die Mathematik ist in einem Anhang von 55 Seiten zusammengefasst. Das Buch enthält eine wertvolle Liste von anorganischen Verbindungen und Metallsystemen mit kristallographischen Daten.

Es ist fraglich, ob es sinnreich ist, wie es in diesem Buch geschieht, nach den IUCr-Verabredungen noch an dem Gebrauch von kX als Wellenlängeneinheit festzuhalten, ob schon natürlich der kX -Wert eindeutig und unabhängig von dem Umrechnungsfaktor ist.

Als Lehrbuch, das einen sehr breiten Überblick von vielen

Gebieten gibt, und als Nachschlagewerk kann dieses Werk den Studierenden und Wissenschaftler sehr wertvoll sein. Der Experte aber wird in seinem Gebiet mehr benötigen und auch einige veralteten Bemerkungen finden.

Es wäre zu empfehlen, bei einer nächsten Auflage unter Beibehaltung des echten Röntgendiffraktionsstoffes und der vielen Information, das Buch neu zu redigieren und einzuteilen.

G. D. RIECK

Technische Hogeschool Eindhoven
Postbus 513
Eindhoven
Niederlande

Notes and News

Announcements and other items of crystallographic interest will be published under this heading at the discretion of the Editorial Board. The notes (in duplicate) should be sent to the Executive Secretary of the International Union of Crystallography (J. N. King, International Union of Crystallography, 13 White Friars, Chester CH1 1NZ, England).

[Radiation Safety in X-ray Diffraction and Spectroscopy

A conference on radiation safety in X-ray diffraction and spectroscopy was held at the University of Pennsylvania, Philadelphia, Pennsylvania, U.S.A., 6-7 January 1970, to fill the need for improved communications between users of X-ray diffraction and spectroscopy equipment, health physicists, and governmental agencies with regulatory responsibilities. Radiation safety in the use of the equipment was discussed from the viewpoint of experimentalists and other users, individuals concerned primarily with radiation safety, and agencies responsible for developing and enforcing guides, standards and regulations. A report of the proceedings has now been published; it includes the papers presented and also the discussions held at the conference. Copies are available from the Superintendent of Documents, U.S. Government Printing Office, Washington, D.C. 20402, U.S.A. The price is U.S. \$2.00 per copy.

Phase analysis: Identification and Quantitative

Determination, University of Hull,
Hull, England, 5-7 April 1972

This conference is being organized by the Crystallographic Group of the Institute of Physics and will cover recent developments and applications of X-ray powder diffraction in the field of phase analysis; invited papers will introduce the main topics. Sessions are contemplated dealing with improved methods of obtaining and handling data, including indexing, with applications to both inorganic and organic materials, and with comparisons between X-ray and other methods such as electron probe microanalysis and d.t.a. For further information write to the Meetings Officer, the Institute of Physics, 47 Belgrave Square, London SW1X 8QX, England.